

玉 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月18日

出 願 Application Number:

特願2003-420724

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2003-420724]

出 願 人

東ソー株式会社

Mayumi TAKAMORI, et al NOVEL ORGANOMETALLIC IRIDIUM April 20, 2004 Mark Boland (202) 293-7060 Q80999 4 of 5

2004年 4 月

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願 【整理番号】 PA211-1261 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 C07F 15/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県相模原市相武台2-5-14-306

【氏名】 高森 真由美

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区六角橋5-21-33-205

【氏名】 大島 憲昭

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県海老名市上今泉3丁目2番6号レオパレスサンブリッジ

IV207号室

【氏名】 河野 和久

【特許出願人】

【識別番号】 000003300

【氏名又は名称】 東ソー株式会社

【代表者】 土屋 隆

【電話番号】 (03)5427-5134

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-120110 【出願日】 平成15年 4月24日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-208975 【出願日】 平成15年 8月27日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003610 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

一般式「1]

【化1】

$$R_7$$
 R_8
 R_8
 R_8
 R_8

[式中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 は、同一または相異なって水素、ハロゲン、低級アシル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、または低級アルキル基を示す。ただし R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 のすべてが水素の場合を除く。]で表されることを特徴とする、有機イリジウム化合物。

【請求項2】

イリジウム化合物、一般式 [2] で表わされるシクロヘキサジエン誘導体、及び一般式 [3] で表わされるシクロペンタジエン誘導体を反応させることを特徴とする、一般式 [1] で示される有機イリジウム化合物の製造方法。

【化2】

【化3】

【化4】

$$R_7$$
 R_8
 R_8
 R_8
 R_8
 R_8

[式中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 は、同一または相異なって水素、ハロゲン、低級アシル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、または低級アルキル基を示す。ただし R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 のすべてが水素の場合を除く。Mはアルカリ金属を示す。]

【請求項3】

一般式[1]で示される有機イリジウム化合物を原料とすることを特徴とする、イリジウム含有膜の製造方法。

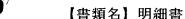
【化5】

$$R_7$$
 R_3
 R_6
 R_4
 R_5

[式中R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、及びR₇は、同一または相異なって水素、ハロゲン、低級アシル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、または低級アルキル基を示す。ただしR₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、及びR₇のすべてが水素の場合を除く。]

【請求項4】

CVD法を用いることを特徴とする、請求項3に記載の製造方法。



【発明の名称】新規有機イリジウム化合物、その製造方法、及び膜の製造方法 【技術分野】

[0001]

本発明は、基板表面にイリジウム含有薄膜を製造するための材料となりうる有機金属化合物に関する。

【背景技術】

[0002]

近年の集積回路は、そのさらなる高集積化、高密度化を可能にするため、比誘電率の大きい強誘電体材料が盛んに検討されている。具体的にはコンデンサー材料としてTa205、あるいはBST((Ba,Sr)TiO3)等が検討されており、これらコンデンサーの電極材料としてN-の電極材料としてN-の電極材料としてN-の電極材料としてN-の電極材料としてN-の電極材料としてN-の電極材料としてN-の電極材料の中心になる。特にイリジウムおよびイリジウム酸化物薄膜の製造方法としては、N-の中心になると注目されている。イリジウムおよびイリジウム酸化物薄膜の製造方法としては、N-の中心になると注目されている。イリジウムおよびイリジウム酸化物薄膜の製造方法としては、N-の中心になると注目されている。N-の中心になると注目されている。N-の中心になると注目されている。N-の中心になると注目されている。N-の中心になると注目されている。N-の中心になると注目されている。N-の中心になると表表られる。

[0003]

このCVD法を用いて薄膜を形成させるための原料物質としては、金属化合物の中でも融点が低く取り扱い性が容易である有機金属化合物が適していると考えられる。従来、イリジウムまたはイリジウム酸化物薄膜を析出させる為の有機金属化合物としては、トリス(ジピバロイルメタナート)イリジウムやトリス(アセチルアセトナート)イリジウムやシクロペンタジエニル(1,5ーオクタジエン)イリジウムなどが検討されている。これらのイリジウム化合物は大気中の安定性が高く、毒性も無いことからCVD原料としての適性を有するものの、常温では固体であり、原料の気化および基板への輸送が困難になるという問題点がある。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

そこで最近では融点の低いイリジウム化合物についての研究が活発に行われている。このイリジウム含有有機金属化合物の低融点化の手法としては、シクロペンタジエン環の少なくとも一つの水素原子をメチル基、エチル基等のアルキル基で置換した化合物とするものがある。例えば、シクロペンタジエン誘導体として、エチルシクロペンタジエニル(1,5ーシクロオクタジエン)イリジウムが開示されている(例えば特許文献 1 参照)。この金属化合物は常温で液体であり、その融点もシクロペンタジエニル(1,5ーシクロオクタジエン)イリジウムに比して低いことから、CVD法に適用する原料物質として必要な特性を具備するものであるとされている。しかしこの化合物は安定性が極めて高いことから錯体の分解温度が高く、必然的に成膜時の基板温度を高くする必要があり、またイリジウム酸化膜が生成しにくいという問題点を抱えていた。

[0005]

一方、シクロペンタジエニル(シクロヘキサジエン)イリジウムも室温で固体であり、 原料の気化および基板への輸送の問題点がある(例えば非特許文献 1 参照)。これまでに 室温で液体の優れた気化特性を示すイリジウム錯体の合成報告例はない。

[0006]

【特許文献1】特開平11-292888号公報

[0007]

【非特許文献 1】B. F. G. Johonson, J. Lewis, and D. J. Yarrow, J. C. S. Dalton, 2084 (1972)。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

本発明は上記技術上の問題点に鑑みてなされたものである。即ち、CVD法により基板上にイリジウムまたはイリジウム酸化物からなる薄膜を形成させる為の有機金属化合物に関して、融点が低く、気化特性に優れ、かつ基板上での成膜温度が低い有機金属化合物を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明者らは、先の課題を解決すべく検討を重ねた結果、シクロペンタジエン誘導体のひとつであるシクロペンタジエニル(シクロヘキサジエン)イリジウムのシクロペンタジエニル環に低級アルキル基を導入することで分解温度を下げられることを見出し、室温で液体の融点を示し、良好な気化特性、分解特性を有する新規なイリジウム化合物を求めて鋭意検討した結果、本発明に到達した。

[0010]

すなわち、本発明は、一般式[1]

[0011]

【化1】

$$R_7$$
 R_8
 R_8
 R_8
 R_8
 R_8

[式中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 は、同一または相異なって水素、ハロゲン、低級アシル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、または低級アルキル基を示す。ただし R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 のすべてが水素の場合を除く。]で表されることを特徴とする、有機イリジウム化合物である。

[0012]

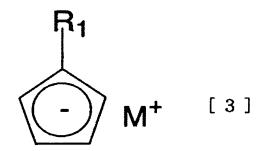
また本発明は、イリジウム化合物、一般式 [2] で表わされるシクロヘキサジエン誘導体、及び一般式 [3] で表わされるシクロペンタジエン誘導体を反応させることを特徴とする、一般式 [1] で示される有機イリジウム化合物の製造方法である。

[0 0 1 3]

【化2】

$$R_7$$
 R_7
 R_8
 R_8
 R_8

【0014】 【化3】



[式中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 は、前記と同様を示す。Mはアルカリ金属を示す。]

更に本発明は、一般式 [1] で示される有機イリジウム化合物を原料とすることを特徴とする、イリジウム含有膜の製造方法である。以下に本発明を更に詳細に説明する。

[0015]

最初に本明細書で用いられる用語の定義ならびにその具体例について説明する。本明細書中に記述の「低級」なる用語は特に断らない限り、この語が付与された基に於いて、炭素数1個以上6個以下の直鎖状、分岐状、または環状の炭化水素基を含有するものであることを示す。

[0016]

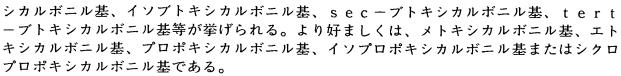
よって R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、または R_7 において用いられる低級アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、s e c - ブチル基、t e r t - ブチル基、ペンチル (r ミル) 基、イソペンチル基、ネオペンチル基、t e r t - ペンチル基、t - メチルブチル基、t - メチルペンチル基、t - メチルペンチル基、t - メチルブチル基、t - ステルブチル基、t - ステルブロピル基、t - ステルブロピル基、t - ステルプロピル基、t - ステルプロピル基、t - ステルプロピル基、シクロブロピルスチル基、シクロブロピルスチル基、シクロブロピルスチル基、シクロブロピルスチル基、シクロブロピルスチル基、シクロブロピルスチル基、シクロブロピルスチル基、ステル基、プロピル表、イソプロピル基、シクロプロピル基である。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

また、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、または R_7 において用いられる低級アルコキシ基としては、具体的に例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、1-メチルブチルオキシ基、2-メチルブチルオキシ基、1-メチルプロピルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、1、1-ジメチルブチルオキシ基、1、1-ジメチルブチルオキシ基、1 、1-ジメチルブチルオキシ基、1 、1-

[0018]

R₁、R₂、R₃、R₄、R₅、R₆、またはR₇において用いられる低級アルコキシカルボニル基としては、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、シクロプロポキシカルボニル基、ブトキ



[0019]

R1、R2、R3、R4、R5、R6、またはR7において用いられる低級アシル基としては、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、1-メチルプロピルカルボニル基、イソバレリル基、ペンチルカルボニル基、1-メチルブチルカルボニル基、2-メチルブチルカルボニル基、3-メチルブチルカルボニル基、1-エチルプロピルカルボニル基、2-エチルプロピルカルボニル基等を挙げることが出来る。より好ましくはホルミル基、アセチル基、プロピオニル基である

[0020]

また、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、または R_7 においては上記した低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基および低級アシル基の他に、同一または異なって水素原子またはハロゲン原子が好ましく用いられる。ハロゲン原子の具体的な例として、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられ、より好ましくはフッ素および塩素である。

[0021]

以上のような $R_1 \sim R_7$ が例示されるが、その中でも $R_1 \sim R_7$ が水素又は低級アルキル基が好ましく、特に水素又は炭素数 $1 \sim 3$ のアルキル基が更に好ましく、一般式 [1] で示される具体的化合物として(エチルシクロペンタジエニル)(1, 3-シクロヘキサジエン)イリジウムまたは(メチルシクロペンタジエニル)(1, 3-シクロヘキサジエン)イリジウムを例示することができる。

[0022]

一般式[1]で表されるイリジウム化合物は、前述のようにイリジウム化合物、一般式[2]で表わされるシクロヘキサジエン誘導体、及び一般式[3]で表わされるシクロペンタジエン誘導体を反応させることにより製造することができる。

[0023]

用いられるイリジウム化合物としては、例えば無機イリジウム化合物または有機イリジウム化合物があげられ、特にイリジウムのハロゲン化物などを例示することができる。具体的には、塩化イリジウム(III)水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸カリウム水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸カリウム水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸カリウム水和物、ヘキサクロロイリジウム(III)酸カリウム水和物、トリス(オキサラト)イリジウム(III)酸カリウム水和物、ヘキサクロロイリジウム(IV)酸アンモニウム水和物、クロロペンタアミンイリジウム(III)塩化物水和物、ジクロロテトラキス(シクロオクテン)二イリジウム、クロロテトラキス(エチレン)イリジウム、ジクロオクテン)二イリジウム、クロロテトラキス(エチレン)イリジウム、ジクロテトラキス(エチレン)ニイリジウム等を例示することができる。

[0024]

その中でも好ましくは、塩化イリジウム(III)水和物、ヘキサクロロイリジウム(IV)酸水和物、ヘキサクロロイリジウム(IV)酸ナトリウム水和物、ヘキサクロロイリジウム(IV)酸アンモニウム水和物、ジクロロテトラキス(シクロオクテン)二イリジウム、ジクロロテトラキス(エチレン)二イリジウム(III)水和物、ヘキサクロロイリジウム(IV)酸ナトリウム水和物、ジクロロテトラキス(シクロオクテン)二イリジウム、ジクロロテトラキス(エチレン)二イリジウムである。

[0025]

また一般式 [3] においてMはアルカリ金属を示すが、アルカリ金属としては、例えばリチウム、ナトリウム、カリウムなどが使用でき、好ましくはリチウム、ナトリウムである。また一般式 [2] で表わされるシクロヘキサジエン誘導体及び一般式 [3] で表わされるシクロペンタジエン誘導体の中でも、置換基として前述のような好ましいR₁ ~ R₇ を有するものが好ましい。

[0026]

反応の順序には特に限定はなく、順次反応させても、また1度に反応させてもよいが、好ましくは、まずイリジウム化合物と一般式 [2]で表わされるシクロペキサジエン誘導体とを反応させ、次いでその生成物に対し一般式 [3]で表わされるシクロペンタジエン誘導体を反応させるという方法が例示できる。後処理は特に限定しないが、一般的な方法として、反応終了後の混合液を濃縮し、得られる混合物からペンタン、ヘキサン、エーテル等の有機溶媒で目的物を抽出した後に、アルミナを担体とし適当な有機溶媒を溶離液としてカラムクロマトグラフィーを行うことにより、又は抽出溶液を減圧下蒸留もしくは昇華させることにより、目的とする本発明のイリジウム化合物を得ることが出来る。

[0027]

一般式 [1] で示される化合物を用いたイリジウム含有膜の製造方法は特に限定しないが、CVD法を用いても良く、原子層蒸着法(Atomic Layer Deposition法:ALD法)を用いても良く、またスピンコート法を用いても良い。また本発明の一般式 [1] で示されるイリジウム化合物を用いて膜形成をする場合、基板上への原料供給方法は特に限定しないが、たとえばバブリング法を用いても良く、リキッドインジェクション法を用いても良い。さらに本発明においてCVD法またはALD法により膜を製造する場合、原料となる有機イリジウム化合物はそのまま用いても良く、また有機溶媒に溶解した有機イリジウム化合物溶液として用いても良い。

[0028]

ここで用いられる有機溶媒としては、たとえば、メタノール、エタノール、1ープロパノール、イソプロパノール、1ーブタノール等のアルコール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸ターシャリーブチル、酢酸イソアミル等のエステル類、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ダライム、ジグライム、トリグライム、ターシャリーブチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、アセトン、メチルブチルケトン、メチルイソブチルケトン、エチルブチルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、メチルアミルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素類が挙げられるが特に限定されるものではない。例えばこれらの群から選ばれる一種または二種以上のものが用いられる。

【発明の効果】

[0029]

本発明のイリジウム化合物は室温で液体のものが多く、それらをCVD原料として用いた場合にはガスバブリングにより定量的に供給できる。また、従来の材料よりも低温で熱分解することができるので、基板上にステップカバレッジに優れたIr含有薄膜を形成することが出来る。このように本発明のイリジウム化合物から量産性に優れたCVD法でIr薄膜を形成することができる。

【実施例】

[0030]

次に本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明はこれら実施例によって限定されるものではない。

[0031]

実施例 1 < (エチルシクロペンタジエニル) <math>(1, 3-シクロヘキサジエン) イリジウムの合成および熱分解特性>

クロロビス (1, 3-シクロヘキサジエン) イリジウムは、G.Winkhaus a

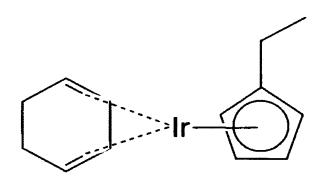
nd H. Singer, Chem. Ber. 99, 3610 (1966) を参考に合成を行った。即ち、エタノール30ml、水20mlに塩化イリジウム2. 0gおよびシクロヘキサジエン4. 3mlを加え、リフラックス条件下23時間反応させた。冷却後析出物をろ過後乾燥し、クロロビス (1, 3-シクロヘキサジエン) イリジウム1. 6gを得た。

[0032]

THF10ml中に、クロロビス(1,3-シクロヘキサジエン)イリジウム 0.5 g を加え、反応フラスコを-78 $\mathbb C$ に冷却し、リチウムエチルシクロペンタジエニド 0.1 8 g の T H F 溶液 2 0 m l を添加した。-78 $\mathbb C$ で 3 0 分撹拌後、徐々に室温まで昇温し、17.5 時間反応させ、濃縮して泥状混合物を得た。その泥状混合物からヘキサンを用いて抽出し、抽出溶液についてアルミナを用いたカラムクロマトグラフィー(溶離液;ヘキサン)を行い、目的物である(エチルシクロペンタジエニル)(1,3-シクロヘキサジエン)イリジウムを 145 m g 得た。

[0033]

【化4】



 1 H-NMR (500MHz, CDCl₃, δ ppm)

5. 1 2 (t, J = 2. 0 H z, 2 H), 5. 0 2 (t, J = 2. 0 H z, 2 H), 4. 9 0 (m, 2 H), 3. 3 2 - 3. 3 7 (m, 2 H), 2. 4 0 (q, J = 7. 5 H z, 2 H), 1. 3 9 - 1. 4 7 (m, 2 H), 1. 2 5 - 1. 2 9 (m, 2 H), 1. 1 1 (t, J = 7. 5 H z, 3 H) $_{\circ}$

IR (neat, cm^{-1})

8 1 0, 1 0 0 0, 1 1 7 0, 1 3 1 5, 1 4 6 0, 2 9 2 5

MS (GC/MS, EI)

 $^{1\ 9\ 3}$ I r τ の(エチルシクロペンタジエニル)(1,3 - シクロヘキサジエン)イリジウムの分子イオンピーク;m / z - 3 6 2

橙色油状物。

[0034]

(分解特性)

得られた(エチルシクロペンタジエニル)(1, 3-シクロヘキサジエン)イリジウムについて、熱分解特性を以下のように調べた。

分解特性測定条件

測定方法:入力補償示差走查熱量測定(DSC)

測定条件: 参照 アルミナ

不活性ガス 窒素 50ml/min

昇温 10℃/min

結果を図1に示す。図1からも明らかなように、本発明のイリジウム化合物は、後述の比較例と比較して分解温度がより低温側にシフトしていることがわかる。

[0035]

比較例1 <エチルシクロペンタジエニル(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム

出証特2004-3029026

の分解特性>

既知化合物エチルシクロペンタジエニル (1,5-シクロオクタジエン) イリジウムについて、分解特性を実施例1と同様に調べた。結果を図2に示す。図からも明らかなように、この既知化合物は実施例1に記載の本発明の化合物と比較して、分解温度がより高温側であった。

[0036]

実施例 2 < (エチルシクロペンタジエニル) (1, 3-シクロヘキサジエン) イリジウムの合成>

実施例 1 と同様にして、クロロビス(1, 3 ーシクロヘキサジエン)イリジウムを得た。 THF15ml中に、クロロビス(1, 3 ーシクロヘキサジエン)イリジウム 0. 9 g を加え、反応フラスコを-78 $\mathbb C$ に冷却し、リチウムエチルシクロペンタジエニド 0. 3 3 $\mathbf G$ $\mathbf G$

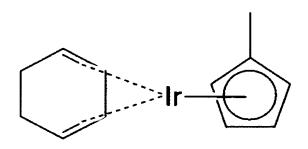
[0037]

実施例3 < (メチルシクロペンタジエニル) (1, 3-シクロヘキサジエン) イリジウムの合成>

実施例 1 と同様にして、クロロビス(1, 3 ーシクロヘキサジエン)イリジウムを得た。 T HF 2 0 m 1 中に、クロロビス(1, 3 ーシクロヘキサジエン)イリジウム 1. 2 g を加え、反応フラスコを-7 8 \mathbb{C} に冷却し、リチウムメチルシクロペンタジエニド 0. 2 6 g 0 T HF 溶液 4 0 m 1 を添加した。添加終了後、徐々に室温まで昇温し、 1 時間反応させ、濃縮して泥状混合物を得た。その泥状混合物からヘキサンを用いて抽出し、抽出溶液を減圧下昇華させることにより、目的物である(メチルシクロペンタジエニル)(1, 3 ーシクロヘキサジエン)イリジウムを 1 0 1 m g 得た。

[0038]

【化5】



 1 H-NMR (500MHz, Benzene-d6, δ ppm) 4. 98 (t, J=2.0Hz, 2H), 4. 93-4. 97 (m, 2H), 4. 87 (t, J=2.0Hz, 2H), 3. 42-3. 47 (m, 2H), 1. 98 (s, 3H), 1. 67-1. 74 (m, 2H), 1. 48-1. 54 (m, 2H) MS (GC/MS, EI)

白色針状結晶。

[0039]

実施例 4 < (メチルシクロペンタジエニル) (1, 3-シクロヘキサジエン) イリジウムの <math>X 線回折 >

実施例3で得られた(メチルシクロペンタジエニル)(1,3-シクロヘキサジエン) イリジウムについてX線回折を行った。結果を図3に示す。

【図面の簡単な説明】

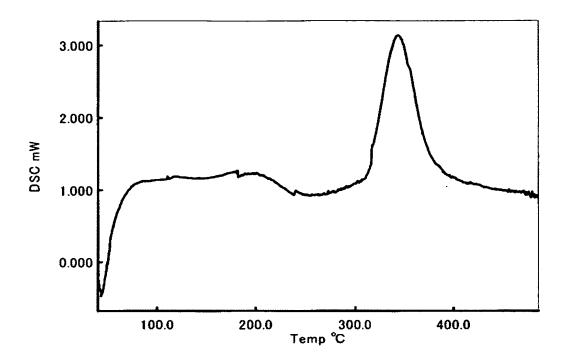
[0040]

【図1】実施例1で得られたDSC曲線を示す図である。

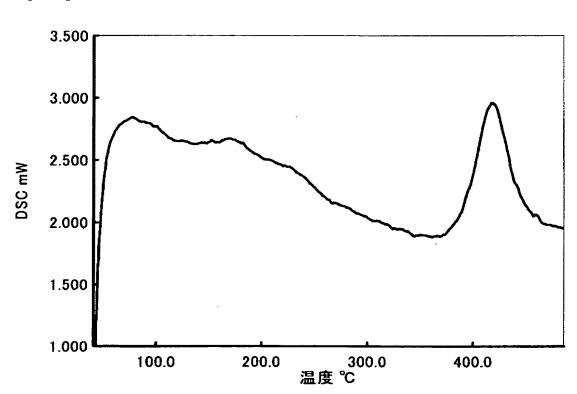
【図2】比較例1で得られたDSC曲線を示す図である。

【図3】 実施例4 で得られた X 線回折を示す図である。

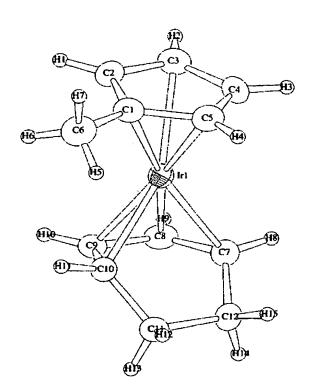
【書類名】図面 【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】CVD法により基板上にイリジウムまたはイリジウム酸化物からなる薄膜を形成させる為の有機金属化合物に関して、融点が低く、気化特性に優れ、かつ基板上での成膜温度が低い有機金属化合物を提供する。

【解決手段】イリジウム化合物、一般式 [2] で表わされるシクロヘキサジエン誘導体、及び一般式 [3] で表わされるシクロペンタジエン誘導体を反応させ、一般式 [1] で示される有機イリジウム化合物を製造する。

【化1】

$$R_{7}$$
 R_{7}
 R_{8}
 R_{6}
 R_{4}

【化2】

【化3】

$$R_7$$
 R_3
 R_6
 R_4
 R_5

[式中 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 は、同一または相異なって水素、ハロゲン、低級アシル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、または低級アルキル基を示す。ただし R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_6 、及び R_7 のすべてが水

素の場合を除く。Mはアルカリ金属を示す。]また、一般式 [1] で示される有機イリジウム化合物を原料としてイリジウム含有膜を製造する。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-420724

受付番号 50302084792

書類名 特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成15年12月24日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年12月18日

特願2003-420724

出願人履歴情報

識別番号

[000003300]

1. 変更年月日

2003年 4月21日

[変更理由]

住所変更

住 所

山口県周南市開成町4560番地

氏 名 東ソー株式会社